



**DIPARTIMENTO DI
FISICA E. Fermi**

Largo Pontecorvo, 3
I-56127 Pisa, Italy

Francesco Fuso

Tel. +39 0502214305, 293
Fax +39 0502214333
fuso@df.unipi.it
<http://www.df.unipi.it/~fuso/>

Pisa, 13/10/2005

Corso di Laurea Specialistica in Scienza dei Materiali

Fisica delle nanotecnologie (FIS/03, 3 cfu)

Programma di massima del corso a.a. 2005/2006

Aspetti fisici di base delle nanostrutture: definizioni, motivazioni, ambito e concetti fondamentali; micro- e nanoelettronica come forza trainante della miniaturizzazione; richiami di elettronica convenzionale: trasporto e sistemi passivi, giunzioni e transistor bipolari, FET e MOS-FET; alcune problematiche di miniaturizzazione nella microelettronica convenzionale: [doping di semiconduttori].

Proprietà di trasporto in sistemi e dispositivi a bassa dimensionalità: densità degli stati e dimensionalità dei sistemi; gas elettronici 2D all'interfaccia tra semiconduttori; effetto Hall quantistico: livelli di Landau, quanto di resistenza di von Klitzing; guide d'onda elettroniche in nanostrutture 1D: livelli di Landauer, split-gate ed altre implementazioni; richiami sull'effetto tunnel da barriera singola e doppia e cenni sul diodo ad effetto tunnel risonante; fenomeni di singolo elettrone ed effetti di Coulomb-blockade e Coulomb staircase in sistemi 0D; [cenni su superconduttori e giunzioni SIS e NIS, effetto Josephson, dispositivi SQUID e RSFQL].

Aspetti nanotecnologici di dispositivi e materiali per l'immagazzinamento di informazioni: immagazzinamento di carica in memorie dinamiche e cenni su dispositivi innovativi (memorie a singolo elettrone, materiali ad alto K, ferroelettrici inorganici ed organici); memorie magnetiche: limite di superparamagnetismo; memorie ottiche read-only e riscrivibili: materiali fotocromici e a cambiamento di fase, limite della diffrazione e nuove tecnologie per la nanoscrittura.

Esempi di sistemi nanotecnologici di natura organica: fondamenti della conduzione in polimeri coniugati e ruolo del drogaggio; trasferimento di carica in molecole singole e nanoelettronica intramolecolare (cavi, switches, diodi,...); crescita per autoassemblaggio molecolare e replicazione: strati autoassemblati di alcanotioli e loro proprietà fondamentali; esempi di replicazione di sistemi di natura biologica e loro possibile impiego.

Proprietà ottiche in sistemi e dispositivi a bassa dimensionalità: cenni sulle proprietà ottiche di nanoparticelle; proprietà ottiche in MQW e quantum dots; cenni su fenomeni plasmonici ed eccitonici; esempi di luminescenza da nanocristalli e silicio poroso; richiami sui laser ad eterogiunzione ed aspetti fondamentali dei laser nanotecnologici (a quantum dot, a cavità verticale, a cascata quantica); esempi di dispositivi elettroluminescenti di natura organica; [cenni su cristalli fotonici; nanofotonica].

Nanostrutture isolate e materiali nanocompositi: [metodi di fabbricazione di nanoclusters]; nanofili metallici e nanometallici; nanostrutture di carbonio: fabbricazione, struttura, proprietà elettroniche e meccaniche di nanotubi di carbonio; esempi di nanocompositi e loro proprietà strutturali.

Tecnologie per la fabbricazione di film sottili: crescita epitassiale ed eteroepitassiale; principali metodi fisici e chimici per la deposizione di film sottili: MBE, MO-MBE, sputtering, PLAD, PE-CVD, LPE, Langmuir-Blodgett; tecniche di nanoimprinting.

Tecnologie per l'osservazione e la definizione per via ottica di nanostrutture: richiami sulla diffrazione ottica, risoluzione spaziale e limite di Abbe; microscopia ottica convenzionale [e confocale]; litografia ottica e a raggi-X,



**DIPARTIMENTO DI
FISICA E. Fermi**

Largo Pontecorvo, 3
I-56127 Pisa, Italy

Francesco Fuso

Tel. +39 0502214305, 293
Fax +39 0502214333
fuso@df.unipi.it
<http://www.df.unipi.it/~fuso/>

Pisa, 13/10/2005

cenni di tecnologia del resist e dell'etching, etching anisotropo, side-wall patterning; cenni sulla manipolazione laser di atomi neutri e litografia atomica.

Tecnologie per l'osservazione e la definizione di nanostrutture mediante fasci di cariche: microscopia elettronica SEM e TEM: funzionamento e principali meccanismi di contrasto, campo chiaro e campo scuro; litografia elettronica e tecniche SCALPEL: vantaggi e limiti connessi.

Tecnologie per l'analisi e la manipolazione di nanoparticelle mediante microscopia a scansione di sonda: generalità sulla SPM: modi di operazione, artefatti, risoluzione spaziale; esempi di SPM: AFM, STM, SFM, EFM, MFM,...; microscopia a campo prossimo ottico (SNOM); nanomanipolazione e nanolitografia mediante SPM.

Nota: gli argomenti tra parentesi quadre sono opzionali.

Testi di riferimento: durante il corso di studio è prevista la distribuzione di materiale didattico. Un elenco parziale dei testi di riferimento utilizzati comprende:

- P.Y. Yu, M. Cardona, *Fundamentals of semiconductors: physics and materials properties*, Springer Verlag (1999).
- F. Bassani, U.M. Grassano, *Fisica dello Stato Solido*, Bollati Boringhieri (2000).
- R. Waser (ed.), *Nanoelectronics and information technology*, Wiley-VCH (2003).
- B. Bushan (ed.), *Springer Handbook of nano-technology*, Springer (2004).
- P.N. Prasad, *Nanophotonics*, Wiley-Interscience (2004).
- M. Ohring, *The materials science of thin films*, Academic (1997).
- G. Timp, *Nanotechnology*, Springer-Verlag (1999).
- M.J. Madou, *Fundamentals of microfabrication*, CRC Press (1997).
- R. Wiesendanger, *Scanning Probe Microscopy: analytical methods (Nanoscience and Technology)*, Springer-Verlag (1998).
- C.P. Poole Jr and F. Owens, *Introduction to nanotechnology*, Wiley (2003).
- J.M. Tour, *Molecular Electronics*, World Scientific (2003).
- J.Y. Ying (ed.), *Nanostructured materials*, Academic Press (2001).
- D. Brandon and W.D. Kaplan, *Micrsostructural characterization of materials*, Wiley (1999).